

PSA-14 ポスター講演一覧

- P-1 その場観察を利用したセラミックスによるヘマタイト還元解析
○石川 信博、木村 隆、竹口 雅樹、水谷 拓人、稲見 隆
物質・材料研究機構 表界面構造・物性ユニット
- P-2 カーボンナノチューブ繊維構造体を用いた分析試料固定
○湯峯 卓哉、前野 洋平
日東電工株式会社
- P-3 新しい原理による回転電場型質量分析器の開発と評価
鈴木 将人、穴井 勇希、野島 雅、堀田 昌直、足立 達哉
東京理科大学理工学研究科工業化学専攻
- P-4 Laser-SNMS分析で視るスパッタ中性粒子の挙動
○石川 文晴、長嶋 悟、柏木 隆宏
株式会社トヤマ
- P-5 文化財科学のためのTOF-SIMS分析の試みー糊として用いられる膠についてー
○樋口 智寛、二宮修治
東京都立産業技術研究センター、東京学芸大学
- P-6 TOF-SIMSデータを用いたGFRP内部における低分子量PCの分布状態の解析方法の検討
○梶原 靖子、長島 広光、長井 聡、青柳 里果
三菱ガス化学株式会社、成蹊大学大学院、三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社
- P-7 異なる多変量解析手法を用いた高分子試料のToF-SIMSデータ解析
横山 有太、岩井 秀夫、○青柳 里果
成蹊大学、物質・材料研究機構
- P-8 多変量解析によるXPSデータの解析
○齋藤 健
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
- P-9 XPSスペクトルデータベース構築のXPS WG活動報告
○吉川英樹、高野みどり、渡部大介、菌林豊、田中博美、陰地宏、勝見百合、木村昌弘、吉原一紘
物質・材料研究機構、パナソニックAIS、アルバック・ファイ、京都大学、米子高専、
高輝度光科学研究センター、YKK、JX日鉱日石金属、オミクロンナノテクノロジージャパン
- P-10 動的Shirley法によるXPSバックグラウンドの算定
○松本 凌、西澤 侑吾、田中 博美、吉川 英樹、田沼 繁夫、吉原 一紘
米子工業高等専門学校、物質・材料研究機構、オミクロンナノテクノロジージャパン
- P-11 スパッタ深さ分析におけるサンプルステージの傾斜角と回転角の誤差がイオン入射角に与える影響
○松村 純宏
株式会社HGSTジャパン
- P-12 試料冷却を用いたオージェ深さ方向分析の基礎的検討
○荻原俊弥、吉川英樹、田沼繁夫
物質・材料研究機構
- P-13 硬X線光電子分光法におけるNi薄膜の光電子有効減衰長の評価
○安野 聡、陰地 宏、小金澤 智之
高輝度光科学研究センター
- P-14 二次電子分光法による全固体Liイオン二次電池の表面電位計測
○朴 商云、井上 雅彦
摂南大学
- P-15 モンテカルロシミュレーションを用いた二次電子収率によるRuO₂/Ruの酸化膜厚推定の試み
○植垣 悠馬、山口 悠馬、山口 義和、井上 雅彦
摂南大学
- P-16 二次電子放出を考えてみよう！
○永富隆清
旭化成株式会社 基盤技術研究所